



中華民國專利證書

發明第 I 894016 號

發明名稱：高深寬比微結構之複合散射光學量測系統

專利權人：國立臺灣大學

發明人：陳亮嘉、傅子英

專利權期間：自 2025 年 8 月 11 日至 2044 年 10 月 15 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長

廖承威

中華民國



114

年

8

月

11

日

